

第12回 D2Tシンポジウム

~ VLSI system design, verification, and test:
as enablers of IoT and big data analytics ~

東京大学大規模集積システム設計教育研究センターでは、株式会社アドバンテストからの寄附によるアドバンテスト D2T 寄附研究部門において、「D2T (Design-to-Test)」の理念に基づき、「設計」と「テスト」の橋渡しを目的とした研究・教育活動を行なっています。その一環として開催して参りました D2T シンポジウムを今年も下記の通り開催いたします。多くの皆様の御参加をお待ち申し上げております。

2017 9/28

THU 10:00-18:00

東京大学 武田先端知ビル 5 階
武田ホール

プログラム

10:00 開会 / Opening

10:30 セッション 1 / Session 1

“Advanced MOS device technology for ultra-low power IoT applications”

高木信一 (東京大学) / Shinichi Takagi (The University of Tokyo)

“Going Digital: Transformation of Society, Industry, and Life”

森川博之 (東京大学) / Hiroyuki Morikawa (The University of Tokyo)

12:00 昼食 / Lunch

13:15 セッション 2 / Session 2

“Power Supply Impedance Emulation to Eliminate Overkills and Underkills due to the Impedance Difference between ATE and Customer Board”

名倉徹 (東京大学) / Toru Nakura (VDEC, The University of Tokyo)

“Common Pitfalls in Application of a Threshold Detection Comparator to a Continuous-Time Level Crossing Quantization”

山口隆弘 (アドバンテスト研究所) / Takahiro Yamaguchi (ADVANTEST Laboratories Ltd.)

14:05 休憩 / Short break

14:15 セッション 3 / Session 3

“Variation and Failure Characterization Through Test Data Analytics”

Kwang Ting Cheng (Hong Kong University of Science and Technology)

“Test-Chip Design for Yield Learning at the 7nm Technology Node”

Shawn Blanton (Carnegie Mellon University)

15:45 コーヒーブレイク / Coffee Break

16:15 セッション 4 / Session 4

“Rethinking Design in the IoT Era - How Formal Methods Help to Meet the Challenges”

Wolfgang Kunz (Technische Universität Kaiserslautern)

“Software in a Hardware View: New Models for Firmware Development and Safety Analysis in IoT Systems”

Dominik Stoffel (Technische Universität Kaiserslautern)

17:45 閉会 / Closing

懇親会 / Reception



参加のお申し込み

参加費：無料

申し込み方法：下記ウェブサイトで事前申込をお願いします

<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/d2t/D2Tsymposium2017-j.html>

主催：東京大学大規模集積システム設計教育研究センター (VDEC)

後援：株式会社アドバンテスト

協賛：(一社) 電子情報通信学会、(一社) 情報処理学会、IEEE SSCS Japan Chapter
IEEE SSCS Kansai Chapter、応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会
ナノテスト学会、(一社) 電子情報技術産業協会、(一社) 日本半導体製造装置協会
SEMI ジャパン、(一社) パワーデバイス・イネープリング協会お問い合わせ：東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター アドバンテスト D2T 寄附研究部門
〒113-0032 東京都文京区弥生 2-11-16 武田先端知ビル 404 号室
Tel: 03-5841-0233 FAX: 03-5841-1093
<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/> E-Mail: ikeno@vdec.u-tokyo.ac.jp